

X 射线粉末衍射仪

所属学校:重庆大学

仪器基本信息			仪 器 编 号		20013941			
			仪器英文名称		X - ray Diffraction			
			所属校内单位		物理学院			
			放 置 地 点		虎溪校区 DS1103			
			仪器负责人		刘高斌	制造商国别	中国	
			制 造 厂 商		北京大学仪器厂			
			规 格 型 号		BDX3200			
			仪 器 原 值		26.00 万元	购置日期	2001.09	
仪器性能信息	主要技术指标	工作电压:36kV;工作方式:2θ/θ 联动;2θ 测量范围:15 ~ 75 度。						
	主要功能及特色	主要测量粉末、块体材料以及较厚的薄膜材料。应用于物相分析、晶向判断、晶粒大小测量等。						
相关科研信息	主要研究方向	材料、材料物理。						
	在研或曾承担的重大项目	为物理学院的研究生培养及科研的平台。						
	学术 论文	近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文:						
		序号	作者	论文题目	期刊名称	年	卷(期)	起止页
		1	F. Wu	Effect of thickness on the properties of Ga - doped Nano - ZnO thin films prepared by RF magnetron sputtering	J Supercond Nov Magn	2010	23	905 - 908
		2	L. P. Peng	Effect of annealing temperature on the structure and optical properties of In - doped ZnO thin films	Journal of Alloys and Compounds	2009	484	575 - 579
	3	L. Fang	Thermoelectric and Magnetothermoelectric properties of In - doped nano - ZnO thin films prepared by RF magnetron sputtering	J Supercond Nov Magn	2010	23	889 - 892	
专利或奖项								
共享服务信息	收费标准	联盟外	100 元/样品					
		联盟内	50 元/样品					
	联系信息	联系人	刘高斌	联系电话	65105870	电子邮件	gbl@cqu.edu.cn	
开放时间	提前预约							